

電子線マイクロアナライザ EPMA-8050G

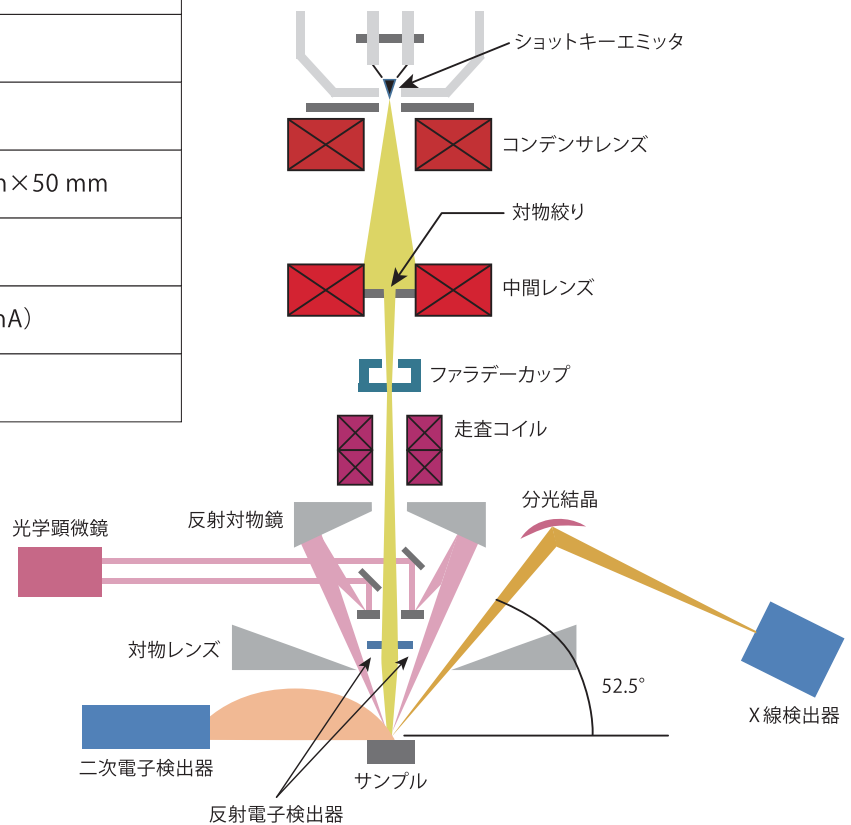
試料に細く絞った電子線を照射し、試料表面から出てくる電子信号や特性X線を検出することによって、試料表面のマイクロ領域（サブ μm オーダー）において、

1. 試料表面の観察（凹凸情報、組成情報）
2. 含有元素の定性分析
3. 含有元素の分布測定（ライン分析・マッピング分析）
4. 元素の化学結合状態の測定（状態分析）

などを行うことができる装置です。

半導体、触媒、セラミックス、ガラス、金属、鋼材など、あらゆる分野の固体物質の表面を分析することが可能です。

電子源	ショットキーエミッタ (FE 電子銃)
分析元素	4 Be ~ 92 U
X線分光器	高感度タイプ5台
最大試料サイズ	100 mm × 100 mm × 50 mm
X線取り出し角度	52.5°
マッピング分解能	20 nm (10 kV-10 nA)
二次電子分解能	3 nm



電子線マイクロアナライザ
Electron Probe Microanalyzer

EPMA-8050G



詳しい情報はこちら